

SCAN TECH 2016のお知らせ

2016/7

公益社団法人 日本顕微鏡学会
走査電子顕微鏡分科会

今年度は、「多様化するニーズに応える SEM アプリケーション～生物・材料から地球環境まで、知られざる世界に迫る～」をテーマとして SCAN TECH 2016 を開催することになりました。各分野の最前線でご活躍の方々に講演をお願い致しました。具体的な内容は次項のプログラムをご覧ください。さらに、講演会終了後のポスターセッション&フリートーカーキングでは、講師やスタッフあるいは参加者同士が自由に討議できる時間を確保してあります。

記

1. 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会
2. 日時：2016年9月16日（金） 10:00～18:30
3. 場所：東京都市大学 世田谷キャンパス
（東京都世田谷区玉堤 1-28-1）
交通 ・東急大井町線 尾山台下車：徒歩 12分
・東急東横線/東急多摩川線 多摩川駅下車→東急バス（二子玉川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3分
・東急田園都市線 二子玉川駅下車→東急バス（多摩川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3分
・東急東横線 田園調布駅下車→東急バス（千歳船橋駅行）東京都市大北入り口下車：徒歩5分
4. 参加費（予稿集代を含む）
事前登録者： 3,500円（日本顕微鏡学会会員）、5,500円（一般）
当日登録者： 4,000円（日本顕微鏡学会会員）、6,000円（一般）
学 生： 無料（学生証を御提示ください。
また、要旨集が必要な方は要旨集代として1,000円頂きます）
*申し込みの際、日本顕微鏡学会会員の方は、会員番号もお知らせください。但し、御所属の機関が法人会員でも、個人は会員扱いになりませんのでご了解願います。
5. 登録および参加費振り込みについて
 - ・登録&振り込み締め切り：2016年8月26日（金）/これ以降の方は当日登録となります。
 - ・登録方法：分科会ホームページ：<http://scantech.jp>
（Webを利用できない方はFAXまたはE-mailをお願いします）
 - ・E-Mail&FAXでの申し込み先：
東京工業大学 地球生命研究所(ELSI) 米光 恭子
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1-IE-33
FAX: 03-5734-3416
E-Mail: yonemitsu@elsi.jp
 - ・振込先：三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店
口座名 公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会 会長 田中 信夫
口座番号 (普) 1094816

周囲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。
なお、最新の情報は走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL: <http://scantech.jp>

来年度の案内をE-mailでご希望の方は、inazato.sachiko@jp.panasonic.comまで
ご連絡下さい。

SCAN TECH 2016

多様化するニーズに応える SEM のアプリケーション ～生物・材料から地球環境まで、知られざる世界に迫る～

日時：2016年9月16日（金）10:00～18:30
場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

1. 開会挨拶 稲里幸子（パナソニック）
2. チャージアップとその対策 渡邊俊哉（日立ハイテクノロジーズ）
3. 生物系前処理基礎技術講座 許斐麻美（日立ハイテクノロジーズ）
4. 材料系前処理基礎技術講座 ～高分子材料編～ 乙部博英（旭化成）
5. パラフィン切片を利用した低真空 SEM による新たな病理診断法の開発と可能性
～始まりは腎生検診断から～ 稲賀すみれ（鳥取大学）
6. 走査電子顕微鏡による切片観察法とその応用 久住 聡（鹿児島大学）
7. ポスター&休憩
 - ・ FIB-SEM（集束イオンビームー走査電子顕微鏡複合装置）を利用しよう！
村田 薫（日本エフイー・アイ）
 - ・ 装置の状態を良く知る（サービスを呼ぶ前に） 鈴木俊明（日本電子）
 - ・ 極低加速電圧 SEM による高分子材料の広範囲モルホロジー観察法
大出奈緒子（JFE テクノリサーチ）
 - ・ EBSD 解析における試料調整美術の最前線 小田武秀（JFE テクノリサーチ）
8. 低入射電圧による軟 X 線分光法 高橋秀之（日本電子）
9. SEM-SPM 連携技術開発と、電池材料、磁性材料への応用
山岡武博（日立ハイテクサイエンス）
10. 後方散乱電子回折（EBSD）の氷への適用における課題と解決策
繁山 航（総合研究大学院大学）
11. 閉会挨拶 乙部博英（旭化成）
12. ポスターセッション&フリートーキング

ポスターセッション&フリートーキングの場では、演者に講演内容のポスターを提示していただき、それを見ながら個別に技術交流することができます。

奮ってご参加下さい。

上記プログラムは暫定のものです。演題、演者は変更になる可能性があります。

最新情報は、走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL : <http://scantech.jp>